9日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-90496

(int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)5月8日

H 05 K 3/40

6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

砂発明の名称 多層配線基板の製造法

②特 顧 昭59-211355

⑫発 明 者 井 村 み ど り 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

砂発 明 者 森 尻 皺 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

⑫発 明 者 華 園 雅 信 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外2名

明 相 督

発明の名称 多層配線装板の製造法 特許請求の範囲

- 1. 高密度実製基板の導体層と、導体層の上に形成された別の導体層との層間接続を、レーザンよびめつき液を接続部に供給することにより形成されるめつきの柱によつて行なりととを特徴とする 多階配額基板の製造法。
- 2. 特許請求の範囲第1項に放いて、上記めつき の柱を形成した後に、絶縁膜を形成することを特 数とする多層配線基板の製造法。
- 3. 特許請求の範囲第1項に於いて、上記めつき の柱は、あらかじめ形成されたスルーホールの中 に形成するととを特徴とする多層配線基板の製造 法。
- 4. 特許請求の範囲第1項に於いて、上配めつき 彼は、化学めつき被であることを特徴とする多層 配線基板の製造法。
- も、特許請求の範囲第1項に於いて、上記めつき 核は、電気めつき液であることを特徴とする多層

配線基板の製造法。

発明の詳細な説明

〔発男の利用分野〕

本発明は多層記線板の形成法に係り、特にマス クレスで層間の導通部を形成させる方法に関する。 【発明の背景】

後来より当位機、電子計算要量などの電子機器 には部品の搭載と、それらの部品間の配線を効率 及く行なりためにブリント回路板が用いられてい る。との回路板は、実装密度の向上のため、多層 板が一般化しつつある。との多層板の層間は種々 の方法で接続されるが、「被層板利用法」(pre ~ laminated)と「後み上げ法」(layer build up)とに分類することが出来る。前者の代表的な 例が、スルーホールを用いる方法である。例えば、 毎期昭 57-154897 に示されている技術を第2 図を参照して述べる。

先才(a)に示すように、絶縁蓄板1の上に導体国 路用の金属箔2が形成され、所定の位置にドリル 加工などによつてスルーホール用の孔3をおける。

,如此成就的一点,也是一点,或其一点。

次に(i)に示すように、金面に化学めつきを行い、 化学めつき借もを設ける。次に(i)に示すように、 レジスト 5 を塗布し、パターンを続付、現像し、 次いで(d)に示すように所定の厚さの電気めつき層 6 を設け、その後レジスト 5 を飲去し、エッテン グして(e)に示すようにスルーホール 7 および回路 パターン 8 を形成していた。

多層回路板は、このようにして形成された寝い 液層板を規則正しく位置合せをして望れて構成す る。この技術には、接着作業の関の層間の位置合 せを維持しなければならないという困難があつた。 又、スルーホール孔あけの加工精度のため、高密 変化がむずかしいという問題があつた。 さらに、 層間の導通を穴の盤面に付けた金属膜でとつてい るために抵抗値が高いという問題があつた。

とれらの間度を解決するための方法として「復 み上げ法」が投案されている。

例えば「最新・ブリント配線技術」(工業調査 会p.27)に示されている技術を第3図を参照し て述べる。

この操作を第3図d)のように繰り返すことにより、第3図(e)、(f)に示すような多層回路板が形成される。ここで、第一層15と終二層17の間の層間16の形成に、第1姿のプロセスを3回繰り返している。その運由は、本従来技術の場合、層間の距離がたとえば100μm必要なのに対し、一回に機層出来るめつき高さがたとえば30μm以下であるためである。

このように、「秋み上げ法」は、高密度化に対応できる有力な方法であるが、プロセス数が増え、特に帰間の導通をとる過程が膨大な量になるという問題が生じていた。

[係明の目的:]

本発明の目的は、層間の導通部をマスクレスで 形成するととにより、プロセス数を低減し且つ導 通部に形成されるめつき柱の高さを任意に制御で きる層間導通部形成方法を提供することである。 〔発明の概製〕

本発明は、多層配線基板の高密度化に対応する 「横歩上げ法」の中で、特にプロセス盤の多い暦 (a)に示すようにキャリアメタル9上にホトレジスト10を並付する。パターンを露光、現像し、次いでAu、Cuめつを後レジスト除去し、エッナングして(b)に示すようなめつを11を形成する。次いで(c)に示すようにポリイミド庭12を形成し、表面を平坦化する。とれて第一届が形成されたととになる。

次いで、第1級⇒よび第4図だ示すよりな過程 かとられる。

第 1 表

全面化ストライクめつき (化学めつき (20)	··· 第4图(b)
次いで電気めつき (21)を施す	(c)
ホトレジスト (22)の強付	(d)
ペターン第光、現像	
似気めつき (23)	··· (e)
エッチング	··· (f)
ポリイミド膜 ** (絶縁膜)形成	··· (g)
褒面平坦化	(h)

関導通部の形成過程のプロセス数低級をおらつた ものである。とのプロセスは、全て、選択的にパ メーン、および導通部を形成させるために必要な ものである。

従来技術で層間導通部のプロセス数が多くなる 理由の一つは、層間距離がある一定以上必要なの に対し、一回に積層出来るめつきの高さが創設さ れる為、同じプロセスを何度も繰り返さなければ ならない、ということである。

先ず、層間距離がある一定以上必要な理由について述べる。

すべての電子装置は、その信号処理を高速化する傾向にある。高速の信号を扱うにはパッケージや配線拡板による信号の遅延は大きな問題となる。パッケージや配線拡板の電気特性を決定する基本パラメータには抵抗R、容量 C、イングクタンスしがある。容量 Cは、第5回の、配線の伝送特性を知るためのモデルにおいて、導体 26 と 27 の間に存在する絶線層 25 の厚み 4 に反比例し、導体の面積 8 に比例する数である。容量 Cが大きい

と、余分に電気エネルギーを書えることになり、 大きな負荷がかかつたようにみえることになる。 したがつて容量でをおさえるためには、層間距離 dをある長さ以上にしなければならない。

次に、これに対して、一回に積滑出来るめつき の高さが制限されてしまう理由について述べる。

第4図(e)から収扱めつき23の高さはフォトレジスト22の厚みによつて決定される。ところがフォトレジストの解光の厚みの限界は30μm程度で、これ以上の厚みになると正常なフォトレジストどして機能しない。したがつて一回に積層出きるめつきの高さには制限がある。

以上2つの理由により、必要な層間導通部分の 厚みを形成するためには、同じプロセスを何度も 繰り返して税用しなければならない。

とのようプロセスの増大化に対し、本発明は、マスクレスでめつき出来ればプロセスの低酸化が 図れるのではないか、という考え方に基づいている。導通部である柱を形成したい部分のみにレー サ光を照射すれば、その部分のみ選択的にめつき

成することが出来る。

本実施例ではめつき液として第2表に示すよう。 なCu化学めつき液を用いた。

旗 2 表

成 分	含有量(14中)
Cu804 · 5H • O	1 0 g
EDTANas 2 HsO	3 0 g
HCHO (37%)	2 0 ms
N = OH	200で9H128にする量
PEG (MW600)	10=
2、2′ーシビリンル	2 0 4%

レーザビーAとして出力 1.0 Wを有する数長 488 n mのA r レーザを用い、ビー 4 を30 m m に 校 つて A 部に照射した。 これと同時に、ノズル型をしたセルから、第2 表に示した化学 C u めつき液を 60 m / m i n の速さで吹出させた。 その結果、 (b)に示すように直径 70 m m、 高さ 100 m m の柱 3 2 を 3 0 0 秒で形成することが出来た。

ととで形成されためつきの柱の直径は、照射す

柱を立てるとどができる。さらにレーザ先の風射 時間をコントロールするととにより柱の高さが自 由に述べるため、層間の厚みが厚くても一回のブ ロセスで対応することが出来る、という利点があ る。

【発明の実施例】

以下、本発明の第一の実施例を第1図を用いて 説明する。

先ず、絶録基板30の上に、導体国路用の金層 循が形成され、ボトレツスト強付、パメーン第光、 現像し、次いでCuめつきし、レツスト酸去、エ ッテングして(3)に示すような第一層パメーン31 を形成する。次いで、層間の導通を所望する32 (第1回では人部)に、選択的なCinの柱32な、 例えば等級昭58−3470 号に示されているよう に、基級をCuめつき液に受潰し、人部にレーザ 光を静止照射するととによつて形成することによって 次給し、かつレーザ光を照射することによって 供給し、かつレーザ光を照射することによって のかってといる。

るレーザのピーム径によつて制御することが出来る。両者の関係を第6囟に示す。

又、めつきの柱の高さは、レーザの無射時間に よつて制御するととが出来る。レーザビー A径 30 mm がの時の両者の関係を終7図に示す。

このようにして、めつきの柱を形成した次に、 第1図(c)に示すようにポリイミド膜34(絶縁膜) を形成した。次いで表面研摩により(d)に示すよう に上部を平坦化した。との(b)・(c)・(d)のプロセス が本実施例で層間導通部を形成する為に必要なも のである。

次いで、ホトレジスト益付、パターン寛光、現像、 めつき、レジスト除去、エンチングにより(e)に示すよりに第二層パターン34が形成される。 との操作を繰り返すととにより、多層回路板を形成するととができる。

尚、本実施例で、第一層パターン \$ 1 と第二層 パターン 3 4 は、ホトレジストを使用することに よつで形成されたが、パターン数が少ない場合に は、めつきの柱 3 2 を形成した時に使用したセル

化氯化基 医对氯酚甲磺胺酚 海水 计连接线 海绵性 医外腺管炎

およびめつき液を用いてパターンを直接接回して もよい。との場合、第8図(a)に示すよりなパター ンを形成したい場合には、第8図(a)に示した矢印 bに沿つてレーザ光をスイーブさせればよい。

以上のように、本実施例によると、層間の導通 部をマスクレスで形成したためにプロセス数を低 減することができる。さらに、形成されるめつき 柱の高さも任意に制御することができる。

本発明の第二の実施例を第9図を用いて説明する。本実施例が第一の実施例を違うのは、層間導通部であるめつきの性が電気めつきによつて形成される点である。その為、めつき柱を形成ければならない。先ず、第9図(a) に、がければならない。先が、第9図(a) に、がはないの上に、がは回路かよびめつとを形成時の、が通路がある。次に、層間の金属的ない、ないのは43は、C部に同所的にかつき液を供給し、かには、C部に同所的にかつき液を供給し、かには、C部に同所的にかつき液を開いて、ないに、ないに、ないに、C部に同所的にかつき液を供給し、かに、C部に同所的にかつを放け、Cuckingには、Cuckingに

成される。この操作を繰り返すととにより、多層 個路板を形成することができる。

本発明の第三の実施例を第10回を参照して述べる。本実施例と第一の実施例との違いは、めつ きの柱があらかじめ形成されたスルーホールの中 に形成されることである。

先ず、絶縁法板 5 0 の上に、冰体回路用の金属 箱が形成され、ホトレジスト並付、パターン貫光、 現像、めつき、レジスト放去、エッチングして(a) に示すような第一層パターン 5 1 が形成する。次 いでポリイミド膜 5 2 を形成し、導通を形成した い部分(第 1 0 図では D部)に、設被的ドリル又 はレーザによりスルーホール 5 3 を形成する。次 に、 D部に局所的にめつき液やよびレーず光を供 給することにより、スルーホール 5 3 内に透択的 なめつき柱を形成することができる。

[発明の効果]

以上のように、本発明によれば、層間の導通部 がマスクレスで形成できるので、プロセス数を低 被した層間浮通部形成方法を提供できる。さらに つレーザ光を照射することによつて形成すること が出来る。

本実施例では、めつき液として第3表に示すよ うたCu電気めつき液を用いた。

第 3 表

成 分	含有量 (14中).
Cu804 - 5H : O	2 2 5 g
H: 304	5 0 m²
HCL (10%)	0.3 🚅

レーザピームとして出力 1 Wを有する波長 488 a mのA r レーザを用い、ピーム径 3 0 A m K 校 つて C 部に探射した。これと同時に、ノズル型をしたセルから第 3 表に示した電気 C u めつき 液を 6 0 m / minの速さで噴出させた。その結果、(c) に示すように 直径 7 0 A m 、高さ 1 0 0 A m の柱 4 3 を 2 5 0 秒で形成することができた。次いで、ホトレジスト途付、パターン 遅光、現像、めつき、レジスト除去、エンテングにより(d)。(e)。(f)の 工程を経て(g)に示すように第二層パターン 4 5 が形

٠,

形成されるめつき柱の高さを任意に創御すること ができる。

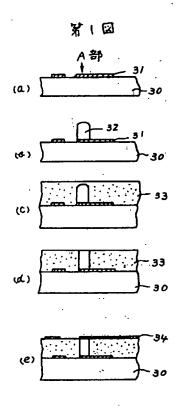
図面の簡単な説明

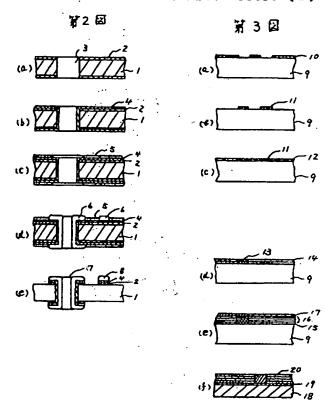
第1図は本発明の第一の実施例を示す工程図、 第2図は「機層板利用法」による従来技術を示す 工程図、第3図かよび第4図は「積み上げて会議の 上での よる従来技術を示す工程図、第5図は層間の の がある程度必要なことを示す説明図、第6図はビーム程とめつき柱径の関係を示す特性図、第7項 はレーザ照射時間とめつき柱高さの関係を示す はレーザ照射時間とめつき柱高さの関係を示す は図、第8図はベターン形成方法の一例を示す工程 図、第10図は本発明の第三の実施例を示す工程 図、第10図は本発明の第三の実施例を示す工程 図である。

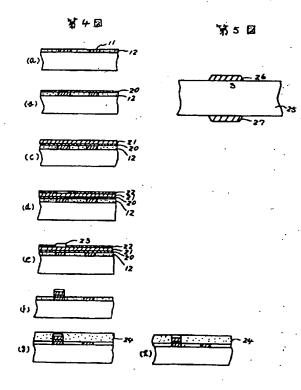
9 …キャリアメタル、10…ホトレジスト、11 …めつき、12 …ポリイミド膜、13 …ホトレジスト、14…ポリイミド膜、30…絶缺茎板、31…第一層パターン、32…Cuめつき柱、33…ポリイミドは、34…ボ二脳パターン。

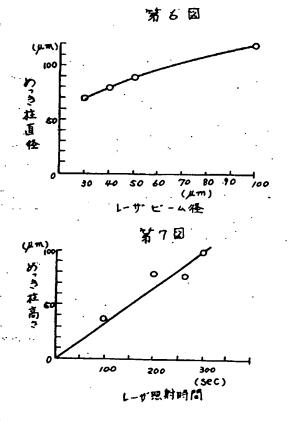
代型人 弁理士 高橋明夫

特開昭61- 90496 (5)









特開昭61- 90496 (6)

